Feature Article HARMA

2006 堀場雅夫賞 受賞者論文

原子及び分子分光法の利点を用いた 蛍光X線/ラマン複合型マイクロアナライザ

Koen Janssens

蛍光X線分析 (XRF)は、多種多様な物質の無機分析に広く使用されている一般的な分析法である。顕微鏡分析 能力 (μ-XRF)を備えた小型のED-XRF装置は、さまざまな形で利用することが可能である。ラマン分光法 (RS: Raman Spectroscopy)は、極めて特別な分子分析法で、多くの無機・有機化合物類の識別に適した優れた方法 であることが実証されてきた。また、ラマン分光装置の小型軽量化も進んでいる。上記の2つの分光法を1台の小 型XRF / ラマン複合型装置に組み込むべく、XRFとラマンによる試料表面の同一領域の同時測定を可能にする 照射及び検出のジオメトリが設計された。文化遺産部門での顔料関連の調査における本装置の有用性を、実例を もとに説明する。

はじめに

以前は大きな試料の平均的な情報しか得られなかった多 くの機器・分析技術が,この20年間で顕微領域に発展し た(赤外顕微鏡法など)。この発展の動因は,次の2つの要 素からなる。(1)物質の複雑度が増していること(ミクロ不 均一な新物質など),(2)天然物質及び人工物質の局所的 な特性変化を調査する必要性が高まっていること(組成, 応力,構造,色など)である。最も確立された無機マイク ロアナリシスは,おそらくEPMA(電子線マイクロアナリ シス)であり,SEM-EDX(エネルギー分散型X線検出器 を備えた走査型電子顕微鏡)と言われる場合もある。しか し,この方法では物質の主要な元素構成の情報しか得ら れない。

FT-IR (フーリエ変換赤外分光装置)は,有機物質の微小 部特性評価に広く使用されているが,結晶化合物及び無 機化合物の分析では用途が限られている。

一方,多くの専門分野,特に物質鑑定,発生源の同定また は試料/発生源の照合が問題となる分野では,次のよう なより詳細なデータが必要となる場合が多い^[1]。

(a)物質の特定領域における微量/極微量元素の特徴識別 (b)有機化合物と無機化合物の複雑な混合物の特性評価

や, 元素は類似するが分子形態が異なる物質を区別

するための,極めて特別な分子情報

こういった点において極めて類似した要件をもつ分野が, 文化遺産部門での物質調査と法医科学の2つの分野であ る。これらの専門分野の目的はかなり異なるが,両分野が 共通して直面する基本的な問題や作業上の制限には,次 のような特筆すべき類似点がある。

- ・多種多様な物質を鑑定する(書類に使用されている物 質(インク,紙)の分析など)。
- ・"特徴識別"の比較によって"未知の"試料と一連の"ライ ブラリ"物質を照合する(ガラス破片,車の塗料や油絵 具などの顔料物質,織物用繊維など)。
- ・犯罪の証拠や貴重な工芸品を,損傷や変質させずに繰り返し分析できる非破壊検査が好ましい(必須の場合が多い)。
- ・破壊サンプリングや破壊分析など、試料をごく微量し か入手できない場合が多い。

蛍光X線分析(XRF)は、多種多様な物質の無機分析に広 く使用されている一般的な方法である。この分野では、い くつかの技術的進歩により、従来の大型波長分散型XRF 分析装置に代わる、より低価格で顕微鏡分析能力を備え た小型のED-XRF装置の発売が促された。現在では、低 価格な低出力X線管,液体窒素不要Si-PIN高分解能ダイオード検出器,効率的なX線集光光学素子がさまざまなメーカから発売されており,微量/極微量レベルの定量分析を30-100 µmの方位分解能で行うことができる^[2]。

ラマン分光法は極めて特別な分子分析法であり,多くの 無機・有機化合物類の分析に適した優れた方法である ことが実証されてきた。また,費用効果が高くかつ小型の レーザ光源,分散グレーティング及びCCD検出器の使用 により,計器の小型化が進んでいる。励起/検出システ ムと,顕微鏡の対物レンズを取り付けた小型測定ヘッド とを光ファイバで接続することにより,サンプリングやそ の他の破壊処理なしで巨視的な対象物の"その場"分析 及び局所分析ができる^[3]。

上記のいずれの方法も,適切な状況で用いた場合には非 破壊的と考えられ,極めて特別な特徴識別情報をもたら すが,次のような機能固有の制限もある。

- ・μ-XRF分光測定法は、主要、微量、極微量元素の定量 的情報を導き出すことのできる比較的簡素かつ系統的 なスペクトルデータを得られるが、化学的/分子特異 性(硫化物と硫酸塩の区別など)は明らかにできない。
- ・μ-Raman分光法は、試料を構成する化合物の化学形態については極めて詳細に特定するが、主要な組成情報しか得られず、またスペクトル情報の解析が重要であり、通常は経験に基づき"未知"スペクトルと"ライブラリ"スペクトルとの比較により行われる。

上記の2つの分光法を, 遠隔測定ヘッドを備えた1台の小 型複合型XRF/ラマン分光装置に組み込み, 高い元素 感度と優れた分子特異性で顕微鏡試料の非破壊分析及 び局所分析を可能にした。この計器は実験室環境で卓上 型装置としても使用できる。また, 巨視的な試料表面の同 一領域をXRFとラマンの両方で同時に測定できるよう, 励起/検出ジオメトリが設計されている。

次に, 複合型分光装置の設計について概説し, 文化遺産 部門での調査における本装置の有用性を実例をもとに説 明する。

複合型XRF/ラマンマイクロアナライザの設計と構造

従来のμ-XRF分光計の照射/検出ジオメトリでは,通常約45°の角度で調査物質に照射し,放出される蛍光X線

を同様の角度で検出する。それに対して、(共焦点)ラマン 照射と検出は、通常、1次レーザ光の集光とラマン散乱光 の捕集の両方を、試料面に垂直なジオメトリで対物レン ズを用いた光学系によって行う。このため、図1(a)に示す ような複合型XRF/ラマン照射/検出のジオメトリ設計 が可能となった。この図で、1次X線は左側の微小焦点X 線管(T)から照射され、焦点距離10 mmのポリキャピラ リーレンズ(P)によって直径約50 μmの点に集束され試 料に到達する。元素選択的蛍光X線信号は、慎重に光軸 調整されたシリコンドリフトチャンバ検出器(D)によって 記録される。検出器コリメータにはチューブが取り付けら れており、 試料表面と検出器窓の間にヘリウムガスを流 して低エネルギーX線の吸収を低減することができる。X 線管と検出器の間には、遠隔ラマンプローブが配置され、 光ファイバを介して1次レーザ光源及びCzerny-Turner 型光学分光器と接続される。1次レーザ光は、20 mm超 長作動距離の高集束対物レンズを介して試料表面に到 達する。このレンズは、ラマン散乱光を捕集して分光器に 導くためにも用いられる。遠隔ラマンヘッドには光学ビデ オによる試料観察システムが備わっており、これによって 試料表面を対物レンズの焦点位置に配置できる。図1(b) はシステム全体の写真を示したものであり、 複合型XRF /ラマン測定ヘッドのすべての構成部品が、約30×40× 50 cm³の比較的小さな容積内に収まっていることがわか る。測定ヘッドの全質量は約10 kgであり、ヘッド全体を、 大きな芸術品やその他の工芸品の上または(水平軸を中 心に90°回転させて)前に配置するのに十分小さい。 レーザ光源から照射された単色光(波長632 nmまたは 785 nmの光など)は、光ファイバケーブルを介して測定 ヘッドに到達し、発生したラマン散乱光は、2本目の光 ファイバケーブルを介して測定ヘッドから分散型分光器

に向かう。測定ヘッドにあるラマンノッチフィルタを交換 することにより,異なる1次レーザ光源間での切り替えが 可能となる。レーザ光源(複数)及びCCDを用いた分散型 分光器は,容易に移動可能な19インチラックに搭載され ており,このラックにはX線管の高圧電源やそのインター フェィス回路,エネルギー分散検出器の回路も搭載され ている。最後に,(a)ラマン分光器パラメータ(グレーティ ング選択,検出するスペクトルウィンドウの位置とサイ ズ,スペクトル捕集時間,繰り返し測定回数)及びX線管 パラメータ(電圧,電流)の制御,(b)ラマン及びX線スペ クトルの同時または逐次データ収集,(c)光学ビデオ画像, ラマン及びX線スペクトル,ラインスキャン及び2次元ラ マン及び/またはXRF強度マップの表示,(d)3次元での 試料移動を担うコンピュータが揃って1つの装置となる。





図1 複合型μ-XRF / μ-Raman分光計のジオメトリと外観写真
(a) 複合型μ-XRF / μ-Raman分光計のジオメトリ
T:X線管, P:ポリキャピラリーX線レンズ, R: 遠隔ラマンヘッド

- M:ULWD顕微鏡対物レンズ(作動距離2 cm), D:エネルギー分散型X線 検出器
- (b) 複合型μ-XRF /μ-Raman分光計の外観写真 ここでは電動式試料台の上に設置されている。この場合、試料は高さを増 すためにAIシリンダAの最上部に置かれている。測定ヘッド全体の幅×奥行 き×高さは約30×40×50 cm³、全体質量は約10 kg。中央ブロックCには チューブが取り付けられており、試料表面とX線検出器窓の間の隙間にヘ リウムガスを流して軽元素に対する感度を向上させることができる。

結果と考察

複合型μ-XRF/μ-Raman分光計の使用例として,16世 紀の戸籍謄本(アントワープ市公文書館(ベルギー)所蔵 の歴史文書)に描かれた盾をかたどった紋章の多くに使 用された顔料の調査について,説明する。この戸籍謄本 は"Pot"一族に関するもので,この一族は数世代にわたっ て中世以降のアントワープで商業活動に携わっていた。 一族のメンバーが結婚するたびに,戸籍謄本に新郎新婦 の紋章が小さく描かれ,結婚の記録が残された。

図2に示された4つの紋章の例から、これらの盾を描くた めに、さまざまな色合いの赤/橙色が使用されたことが わかる。図2(a)の盾の幅広の帯は、明るい橙・赤色の色 合いで描かれているのに対し、図2(c)のライオンの盾の 赤色の背景は、極めて暗い色調の赤色で描かれている。 図2(b)のひし形の盾は、中間色で描かれている。



図2 アントワープの"Pot"一族に関する16世紀の戸籍謄本に描かれた、4つの盾をかたどった紋章例
(a)左 (b)中央 (c)右

上記の複合型µ-XRF/µ-Raman分光計を用いて, XRF 分光測定とラマン分光法の両方によって非破壊的に分析 すれば、これらの盾に使用されている顔料を特定できる。 図2の盾の狭い領域に照射して得られたXRFスペクトル を図3に示す。図3(c)のスペクトル中にHg-La, Hg-L β及 びS-Kaの特性X線が見られること、及び描画の(暗い)赤 色から,赤色鉱物の辰砂(HgS)の存在が容易に推測され る。しかし、図2(a)の赤色の原料を、関連するXRFスペク トル(図3(a))の情報から判断するのはそれほど容易では ない。このスペクトルは、(Pb-M, Pb-La及びPb-L β の特 性X線によって示される)Pb(鉛)の存在を示している。し かし、16世紀にはPb(鉛)を含有する顔料が複数使用され ていたことが知られており(鉛白PbCO3・Pb(OH)2, 鉛丹 Pb₃O₄, 一酸化鉛PbO(赤色)など), 観測された色も, 鉛白 の下地に赤色の有機染料の透明な層を塗り重ねたものと 考えられ,使用された顔料または顔料の組み合わせを明

確に特定することはできない。XRFスペクトルにはHg(水 銀)が見られないことから、この特殊な橙赤色の色合いを 作り出すのに、辰砂は全く使用されなかったことがわか る。図2(a)の赤/橙色の盾内部の個々の顔料粒子から得 られたラマンスペクトル(図4(b))を、鉛丹(図4(a))と辰砂 (図4(c))のスペクトルと比較すると、この場合では橙赤 色の鉛丹顔料が使用されたことになる。この盾の帯の内 側、数箇所のポイントで行ったラマン及びXRFの測定結 果に有意な違いはみられなかった。従って、この盾の赤 い帯は、鉛丹のみを使用して描かれたと考えられる。

図2(b)のひし形の紋章盾は、状況が異なっている。この 盾のXRFスペクトル(図3(b))には、極めて強いPbライン があるが、それより強度は弱いもののHg-Lα及びHg-Lβ のラインも見られ、これはPbとHgが約10:3の比率で含 まれた混合物の存在を示している。さまざまな位置で測 定されたXRFスペクトルから、この質量比の変動はごく わずか(<10%)であり、辰砂と別のPb含有顔料の混合物 を使用したか、またはPb含有量が比較的多い下地層(鉛 白など)の上にかなり薄い赤色の辰砂層を塗り重ねたこと が示唆される。この場合もやはり、XRFスペクトルの情 報だけでは明白な顔料特定には至らない。一方、この盾 の赤い層の異なる粒子と隣接する箇所から得られたラマ ンスペクトルを考慮することによって、使用された顔料を



図3 紋章盾の赤色領域のXRFスペクトル (a) 橙赤色の帯(b) 橙赤色の背景(c) 暗赤色の背景領域



図4 顔料及び紋章盾の赤色領域のラマンスペクトル

(a)鉛丹, (b)図2(a)に示される紋章盾の赤色領域(橙赤色の帯), (c)辰砂, (d)図2(c)に示される紋章盾の赤色領域(暗赤色の背景領域) ラマンスペクトルのバックグラウンド補正は行われていない。

Feature Article 特集論文 原子及び分子分光法の利点を用いた蛍光X線/ラマン複合型マイクロアナライザ

特定することができる。いくつかの位置では,純粋な鉛 丹(図5(a))または純粋に近い辰砂(図5(c))のラマンスペ クトルが観測されているが,ラマンスペクトルが得られた 多くの位置(約30%)で,両方の顔料の特徴的なラマンラ インが見られている。例を図5(b)に示す。また,図2(b)の 盾の赤い塗料層を50倍の倍率で注意深く観察すると,直 径が10 µmより小さいさまざまな色の粒子が存在するこ とがわかる。レーザ光を隣接する2つ以上の鉛丹または 辰砂の粒子に同時に照射すると,ラマンスペクトルに明 らかに両方の特徴的信号が見られるであろう。図4及び 図5に示すラマンスペクトルは,バックグラウンド補正を 行っていないため, 塗料の下の紙, または, 結合媒体の 残留物(アラビアゴムまたは別の多糖類と思われる)が電 子励起されることにより, 連続的で高いバックグラウンド がみられる。この種の単一塗料層が, 限定量の結合媒体 が添加された水性ペーストで描かれている場合であれ ば, 個々の顔料粒子のラマン分析は比較的容易である。 もっと結合媒体の多い物質についても, 複合型μ-XRF/ μ-Raman分光計を使って, XRFとラマンのスペクトル が得られることが, 油絵や油絵から取った試料の分析に よって実証されている^[4]。



図5 図2(b)に示される盾の橙赤色領域の数箇所の位置から得られたラマンスペクトル

(a)主に鉛丹(b)辰砂と鉛丹の混合物(c)主に辰砂の特徴的ラマンラインが見られるが, 鉛丹の主なラマンライン548cm¹も見られる。(d)高倍率の光学写真(橙-赤の小さな丸は, それぞれの測定位置を示す) すべてのスペクトルに, 紙及び顔料結合媒体による蛍光バックグラウンドが観測されている。

おわりに

本稿では, 蛍光X線分析による迅速な元素分析の利点と, ラマン分光法の極めて特別な特徴識別能力を組み合わ せた複合型μ-XRF/μ-Raman分光装置が, 文化遺産の 研究においてしばしば行なわれる顔料物質の特定に, 非 常に有用であることを例証した。測定ヘッド部の小型化 により, 大きな芸術品や工芸品も非破壊で分析可能であ る。今後, 犯罪捜査の物的証拠や土壌などの環境資料は もちろん,その他のさまざまな分野にも広く使われていく ものと考えている。

参考文献

- [1] Koen H.A Janssens, R.E. Van Grieken (Eds.), Non-destructive Microanalysis of Cultural Heritage Materials, Amsterdam, The Netherlands, Elsevier, ISBN 0-444-50738-8, 800 (2004).
- [2] K. H.A Janssens, F. C.V. Adams, A. Rindby (Eds.), Microscopic X-ray fluorescence analysis, Chichester, Wiley, 419 (2000).
- [3] C. Coupry, D. Brissaud, in: Raman Microscopy, Development and Applications, Turrell G, Corset J (eds), London, Academic Press, 421 (1996).
- [4] K.S. Andrikopoulos, S.X. Daniilia, B. Roussel, K. Janssens, In vitro validation of a mobile Raman-XRF micro-analytical instrument's capabilities on the diagnosis of Byzantine icons, *J. of Raman Spectroscopy*, **37**, 1026-1034 (2006).



Koen Janssens University of Antwerp Department of Chemistry Professor Ph.D.